

# 中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1306—2011

JJF 1306—2011

## X 射线荧光镀层测厚仪校准规范

Calibration Specification for  
X-Ray Fluorescence Coating Thickness Instruments

中华人民共和国  
国家计量技术规范  
X 射线荧光镀层测厚仪校准规范  
JJF 1306—2011

国家质量监督检验检疫总局发布

\*

中国质检出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)  
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 21 千字  
2011 年 12 月第一版 2011 年 12 月第一次印刷

\*

书号: 155026·J-2648 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



JJF 1306-2011

2011-09-14 发布

2011-12-14 实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

B.3.1.2 对于没有几何台阶形貌的标准块，在 X 射线荧光镀层测厚仪上通过与具有更高准确度等级的标准块进行比较测量。

B.3.2 金属箔厚度标准片

B.3.2.1 比较测量：金属箔片厚度的测量，在 X 射线荧光镀层测厚仪上通过与具有更高准确度等级的标准块进行比较测量。

B.3.2.2 绝对测量：采用非接触式直接测量方法，不建议采用传统机械接触式仪器测量。

## X 射线荧光镀层测厚仪校准规范

Calibration Specification for  
X-Ray Fluorescence Coating Thickness Instruments

JJF 1306—2011

本规范经国家质量监督检验检疫总局于 2011 年 9 月 14 日批准，并自 2011 年 12 月 14 日起施行。

归口单位：全国几何量长度计量技术委员会

起草单位：中国计量科学研究院

深圳市计量质量检测研究院

江苏天瑞仪器股份有限公司

本规范委托全国几何量长度计量技术委员会负责解释

**本规范主要起草人：**

朱小平（中国计量科学研究院）

王强兵（深圳市计量质量检测研究院）

李玉花（江苏天瑞仪器股份有限公司）

**参加起草人：**

杜 华（中国计量科学研究院）

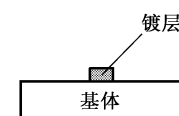
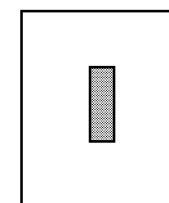
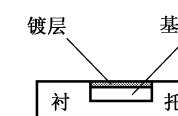
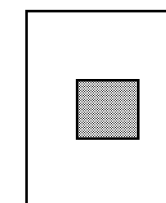
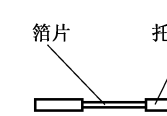
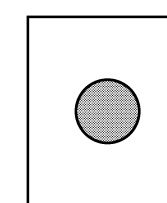
王蔚晨（中国计量科学研究院）

**附录 B****厚度标准块的技术要求****B.1 厚度标准块（片）的等级及允许偏差**

厚度标准块（片）的等级及允许偏差见表 B.1。厚度标准块（片）结构见图 B.1～图 B.3。

**表 B.1 厚度标准块（片）的等级及允许偏差**

标准厚度块（片）的等级	厚度测量结果不确定度	镀层及基体金属材料的纯度
1 级	2%	99%以上
2 级	5%	99%以上

图 B.1 具有几何台阶  
镀层厚度标准块图 B.2 无几何台阶  
镀层厚度标准块图 B.3 金属箔  
厚度标准片**B.2 厚度标准块的通用技术要求****B.2.1 镀层厚度标准块**

以镀层的型式覆盖在金属基体上的标准块，镀层厚度测量区域不应有影响测量结果的脏点、划伤、破损、腐蚀存在。

**B.2.2 金属箔厚度标准片**

金属箔片厚度测量区域不应有影响测量结果的脏点、划伤、破损、腐蚀、皱折、翘起变形存在，工作表面应平整。

**B.2.3 外形尺寸要求**

对厚度标准块或标准片的外形尺寸无特殊要求，只要适合于携带、保存，在测量时安装方便即可，有效工作区域应大于仪器的测量光斑尺寸。

**B.3 厚度标准块（片）的测量方法****B.3.1 镀层厚度标准块**

B.3.1.1 具有几何台阶形貌的标准块，一般采用低测力、触针扫描式的台阶仪、光学轮廓仪或原子力显微镜等仪器进行测量。